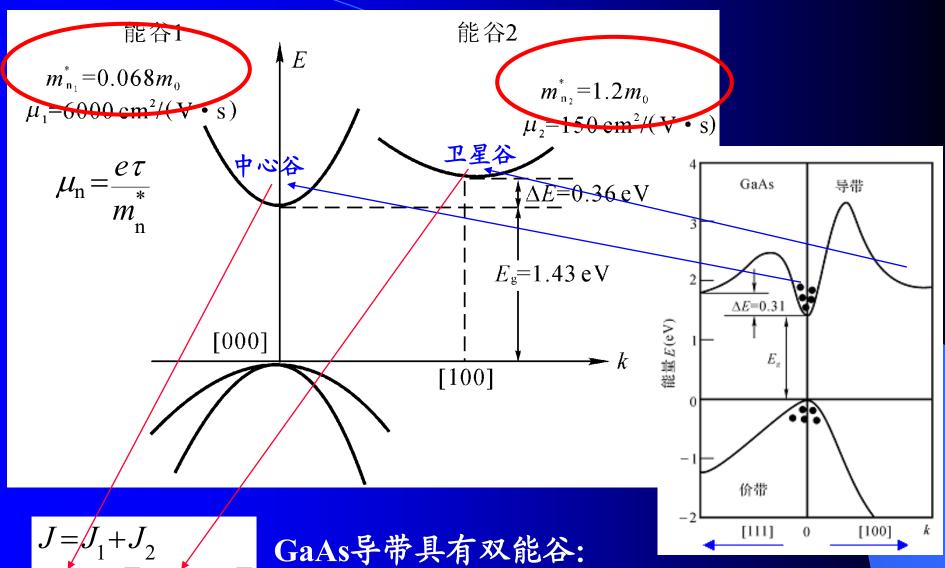
负阻效应的原因



 $= n_1 e \mu_1 E + n_2 e \mu_2 E$ $=(\sigma_1+\sigma_2)E$

中心谷(低能谷1)、卫星谷(低能谷2

• 低电场(C区)

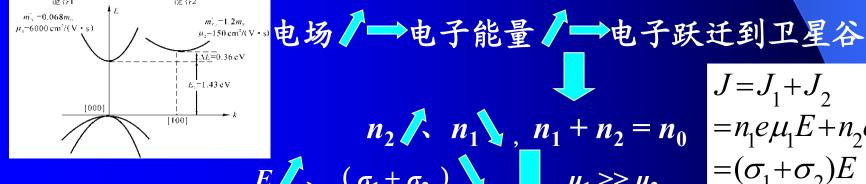
中心谷与卫星谷的能谷差: $0.36 \text{ eV} >> k_{\rm B}T$ (室温) 0.026 eV



满足欧姆定律



· 电场增加 (后C区)



$$n_2$$
, n_1 , $n_1 + n_2 = n_0$

$$E$$
, $(\sigma_1 + \sigma_2)$ $\mu_1 >> \mu_2$

$$J = J_1 + J_2$$

= $n_1 e \mu_1 E + n_2 e \mu_2 E$
= $(\sigma_1 + \sigma_2) E$

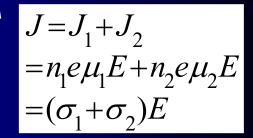
偏离欧姆定律





· 电场增加/(A区)

电场 $\longrightarrow n_1$ 、 n_2 $\longrightarrow \sigma_1$ 、 σ_2 $\longrightarrow E$ $\bigcirc (\sigma_1 + \sigma_2)$ \bigcirc \bigcirc



• 电场增加 (B区)

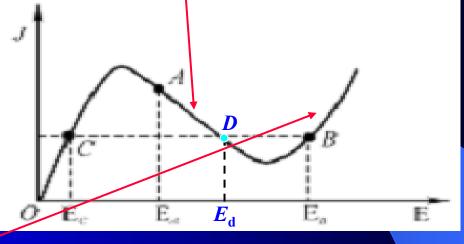
电场 $n_1 \sim 0$, $n_2 \sim n_0$

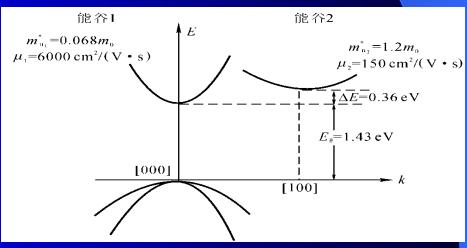


 $J = n_2 e \mu_2 E = n_0 e \mu_2 E = \sigma_B E$



满足欧姆定律



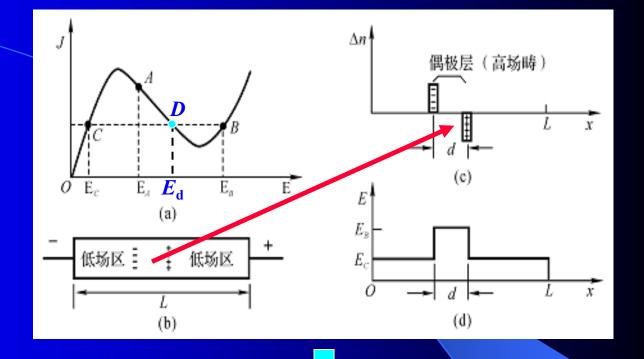


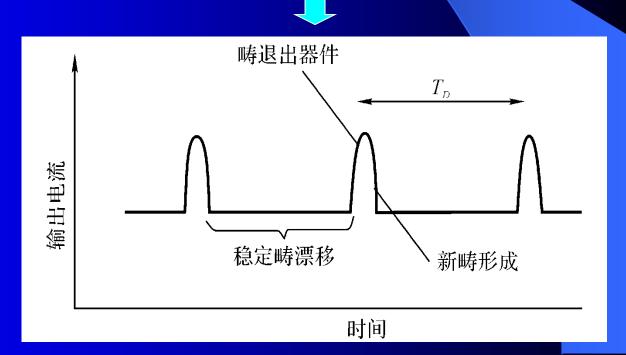
 $J = \sigma_{\rm C} E$ $J = \sigma_{\rm B} E$ C:

B:

A: 耿氏效应区

n型GaAs: 耿氏 振荡电流频率为 $0.47 \sim 6.5 \text{ GHz}$

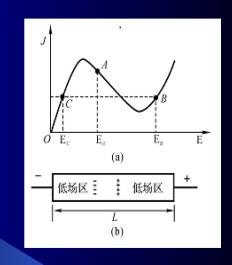




畴区的形成 内部不均匀, 电子浓度涨落

局部高阻区,区内电场高于区外

高阻区内电子速度慢



- 靠阳极一侧,区外电子漂移速度比区内大,形成毛尽层;
- 靠阴极一侧,区外电子漂移速度比区内大,形成电子积累层。

空间电荷偶极层(偶极畴):畴内正负电荷产生与外电场同方向电场,使得畴内电场增强,相应畴外电场降低

畴内电场增强,内部漂移速度不断下降,偶极畴不断生长

随畴内电场增强,畴外电场降低,高场和低场都越出负微分电阻区

畴内畴外电子以共同的速度漂移,畴停止生长,稳态畴向阳极移动。

• 畴与电流脉冲



畴区电场 $\boxed{ (E_d + \Delta E) }$

非畴区电场 $(E_d - \Delta E)$

电子基本位于卫星谷B

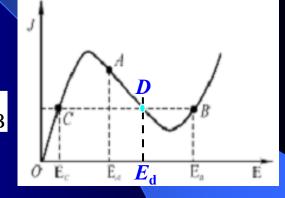
电子基本位于中心谷C

稳定时

形成畴区: $J(E_{\rm C})=J(E_{\rm B})=J(E_{\rm d})=J_0$

 $\mu_1 > \overline{\mu_2}$

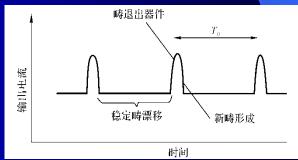
畴区内与外的电子漂移速度相同 $v_d = \mu_1 E_C = \mu_2 E_B$



整个畴区向"+"极(阳极)移动

到达阳极

畴区消失、整个区域 $E = E_d$



进入下一轮畴区形成、运动、消失的过程

- 畴区消失与形成时间 \longrightarrow 脉冲宽度
- 畴区漂移时间(渡越时间) Δt_2 脉冲周期 $(\Delta t_1 + \Delta t_2) \approx \Delta t_2$
- 振荡频率 $\upsilon = (\Delta t_1 + \Delta t_2)^{-1} \approx 1/\Delta t_2 = v_d/(L-d) \approx v_d/L$
- · 对于某n型GaAs样品, $v_{\rm d} \approx 10^7$ cm/s, L = 0.1 mm



不含pn结或其他界面的体效应微波器件

• 其它耿氏器件材料

n型InP、GdTe、InAs、Ge......

3.7 固态电子能谱

单色光(如X射线、紫外光)、电子(离子)束照射(轰击)样品

电子受激发射出来,测量能量分布

样品结构和成分信息

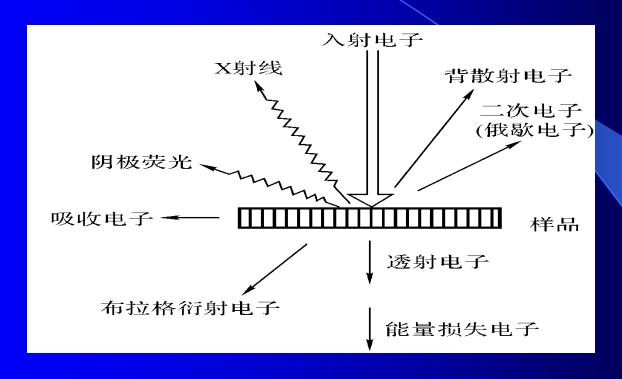
电子能谱:

- · X射线光电子能谱(XPS)
- 紫外光电子能谱(VPS)
- · 俄歇电子能谱(AES)
- 电子探针X射线显微分析(EPMA)
- · 广延X射线吸收精细结构(EXAFS)

1981年,光电子能谱: Siegbahn获诺贝尔物理学奖

3.7.1 电子、光子、离子同固体相互作用概貌

• 电子束入射到固体样品表面



- 光子照射固体样品表面 光电子、俄歇电子(俄歇Auger效应)
- 离子東入射到固体样品表面 二次电子、二次离子、X射线

3.7.2 俄歇电子电子能谱

$$E_{\rm A} = E_{\rm K} - E_{\rm L1} - E_{\rm L2,3} - \varphi$$

俄歇电子能量 能级电子结合能 样品功函数 (逸出功)

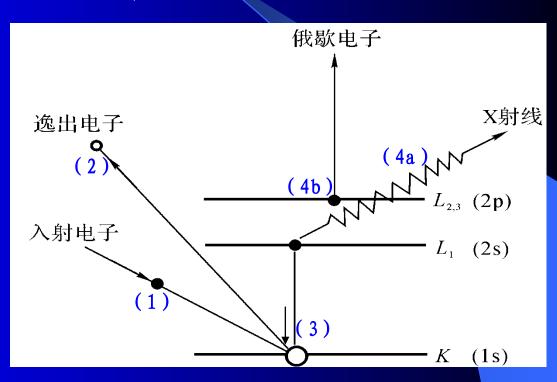
内层能级(深能级)电子 结合能 $E_{\rm K}$ 、 $E_{\rm L1}$ 、 $E_{\rm L2,3}$ 是 每个元素固有的



测得俄歇电子能量



确定俄歇电子发射的元素



元素检测 (元素的指纹鉴定)

3.7.3 X射线光电子能谱

原子相互靠近 → 分子

- 外壳层电子轨道交叠 → 能带
- 内壳层电子轨道相对独立 基本保持孤立原子特征
- 内壳层电子结合能较大
- · 原子序数Z/ 电子结合能/

例如: K壳层电子结合能: Z=4 (Be), 111 eV

Z = 18 (Ar), 3203 eV

要使电子逸出固体样品,必须克服电子结合能和电子逸出功

- ·可见光、红外光的光子能量不够(1.8~3.1 eV)
- · 紫外光的光子能量也不够(3.1~42 eV)

紫外光电子能谱 → 外壳层价电子特性

· X射线可以激发样品内壳层能级的电子逸出(42~12400 eV)

X射线光电子能谱

内壳层电子保持孤立原子特征

X射线光电子能谱 → 鉴定分子、原子价、化合物结构